METHOD AND SYSTEM FOR ANALYZING MICRO AMOUNT WITH THERMAL LENS MICROSCOPE

Patent number:

JP2000356611

Publication date:

2000-12-26

Inventor:

KITAMORI TAKEHIKO; SAWADA SHIRO

Applicant:

KANAGAWA KAGAKU GIJUTSU AKAD

Classification:

- international:

G01N25/16; G02B21/00; G01N25/00; G02B21/00;

(IPC1-7): G01N25/16; G02B21/00

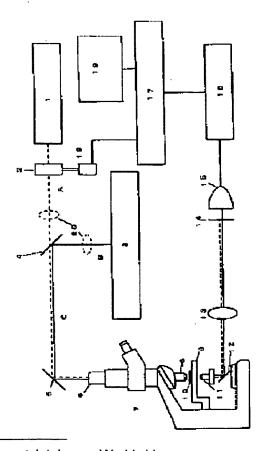
- european:

Application number: JP19990168772 19990615 Priority number(s): JP19990168772 19990615

Report a data error here

Abstract of JP2000356611

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a method and system for analyzing a micro amount with a thermal lens microscope, easy to handle with no limit in measuring object, and capable of analyzing with high resolution. SOLUTION: This method for analyzing a micro amount with a thermal lens microscope applies detecting light B to a thermal lens formed by applying excited incident light A into a sample 10, measures the diffusion after transmission therethrough of the detecting light B by the thermal lens, and thereby detects a substance in the sample 10, in an optical microscope. The optical adjustment is made so that the focus of the excited light A is in no coincident with that of the detecting light B, in the sample 10.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-356611 (P2000-356611A)

(43)公開日 平成12年12月26日(2000.12.26)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

G01N 25/16

G02B 21/00

G01N 25/16

C 2G040

G02B 21/00

2H052

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顧平11-168772

(22)出願日

平成11年6月15日(1999.6.15)

特許法第30条第1項適用申請有り 1998年12月15日発行

の日本工業新聞に掲載

(71)出顧人 591243103

財団法人神奈川科学技術アカデミー

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号

(72)発明者 北森 武彦

千葉県松戸市松戸2172-1-308

(72)発明者 澤田 嗣郎

東京都荒川区南千住6-37-2-504

(74)代理人 100093230

弁理士 西澤 利夫

Fターム(参考) 20040 AA02 AB07 AB12 BA18 BA24

BA27 CA03 CA12 CA18 CA23

EA06 EB02 FA10 HA02

2H052 AA00 AA07 AB01 AB26 AC05

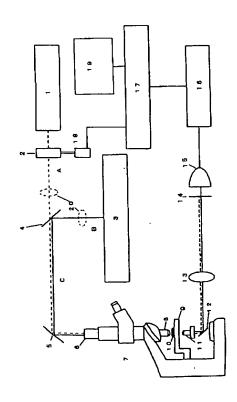
AC14 AC34 AF06

(54) 【発明の名称】 熱レンズ顕微鏡超微量分析方法とその装置

(57) 【要約】

【課題】 操作が簡便であり、かつ、測定対象が限定されることのなく、高い分解能による分析が可能となる熱レンズ顕微鏡超微量分析方法とその装置を提供する。

【解決手段】 光学顕微鏡において、励起光(A)を入射し、励起光(A)が試料(10)中に照射されることにより形成される熱レンズに検出光(B)を入射し、熱レンズによる検出光(B)の試料透過後の拡散を測定することにより試料(10)中の物質を検出を行う熱レンズ顕微鏡を用いた超微量分析方法であって、光学的調整により、試料(10)中における励起光(A)および検出光(B)の焦点位置が一致しないようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光学顕微鏡において、励起光を入射し、 励起光が試料中に照射されることにより形成される熱レ ンズに検出光を入射し、熱レンズによる試料透過後の検 出光の拡散を測定することにより試料中の物質の検出を 行う熱レンズ顕微鏡を用いた超微量分析方法であって、 光学的調整により、試料中における励起光および検出光 の焦点位置が一致しないようにすることを特徴とする熱 レンズ顕微鏡超微量分析方法。

励起光と検出光の周波数を異なるものと 【請求項2】 し、色収差のあるレンズを対物レンズとして用いること により、試料中における励起光および検出光の焦点位置 が一致しないようにする請求項1記載の熱レンズ顕微鏡 超微量分析方法。

【請求項3】 励起光または検出光のいずれかを角度を 持たせて光学顕微鏡へ入射することにより、試料中にお ける励起光および検出光の焦点位置が一致しないように する請求項1記載の熱レンズ顕微鏡超微量分析方法。

【請求項4】 光学顕微鏡としての接眼レンズと対物レ ンズ並びに試料ステージを備えた請求項1の方法のため の装置であって、励起光と検出光の光源と、試料中での 励起光と検出光の焦点位置を一致させない光学調整装置 と、試料透過光の集光装置とを有し、励起光と検出光と は接眼レンズに入射されて対物レンズより試料ステージ 上の試料に放射され、光学調整装置によって励起光と検 出光の試料中の焦点位置は一致しないようにされ、試料 透過光は集光装置により集光されて透過光のうちの検出 光のみから分析が行われることを特徴とする熱レンズ顕 微鏡超微量分析装置。

【請求項5】 励起光と検出光の周波数を異なるものと した請求項4の装置であって、色収差のあるレンズを対 物レンズとして光学調整装置を構成している熱レンズ顕 微鏡超微量分析装置。

【請求項6】 請求項4の装置であって、ビームエキス パンダーにより、励起光または検出光のいずれかを角度 を持たせて光学顕微鏡に入射するようにして光学調整装 置を構成している熱レンズ顕微鏡超微量分析装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

顕微鏡超微量分析方法とその装置に関するものである。 さらに詳しくは、この出願の発明は、光学顕微鏡系とし て熱レンズ顕微鏡を構成し、微小空間内の超微量な試料 物質を高精度に高空間分解能で分析することを可能とす る超微量分析方法とそのための装置に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術とその課題】半導体や生体試料、あるいは 各種の液体試料等の分析や測定を目的として分光分析法 が広く利用されてきている。しかし、これまでの分光分 50

析法では、微小空間での微量あるいは微小物質を分析す る場合には、測定条件として真空が必要であったり、電 子ビームやイオンビームの利用等の使用にともなって、 試料が破壊ないし損傷される等の問題があった。また、 溶液あるいは生体組織中等の超微量の試料を扱う場合に は、光学領域の顕微鏡の使用が必須となるが、高精度で 高い空間分解能での分析が必要とされるこのような光学 領域の顕微鏡として実際的に利用されているのはレーザ 一蛍光顕微鏡に限られており、このため、分析の対象も おのずとレーザー蛍光顕微鏡蛍光分子に限られている。 このような事情から、従来では、真空場を必要とするこ とがなく、非接触、非損傷での分析が可能であって、し かも分析対象が蛍光分子に限定されることなしに、高精 度で、高い空間分解能での分析が可能とされる光学顕微 鏡の実現が求められていた。

【0003】そこで、従来より、これらの要求を満たす ものとして光熱変換現象による熱レンズ効果を利用した 熱レンズ顕微鏡が注目されてきた。しかしながら、実際 には、光学顕微鏡として、つまり、接眼レンズと対物レ ンズというレンズ構成による光学顕微鏡で熱レンズ顕微 鏡を実現することは極めて困難であった。

【0004】熱レンズ顕微鏡では、励起光と検出光との 関係を、励起光が試料中に入射されることにより形成さ れる熱レンズに検出光を入射し、試料透過後の検出光の 拡散から試料物質の検出を行うものとすることが欠かせ ない。しかし、光学顕微鏡の構成では、励起光と検出光 の焦点位置が一致してしまうことから、上記の関係は、 実現困難であると考えられてきた。

【0005】もちろん、これまでにもいくつかの工夫が 提案されている。しかし、いずれの場合も、操作が複雑 過ぎるなどの理由から、具体化されなかった。そこで、 この出願の発明は、以上の通りの事情に鑑みてなされた ものであり、操作が単純であり、かつ、測定対象が限定 されることなく、高精度で高い空間分解能による分析が 光学顕微鏡の構成で可能となる、新しい熱レンズ顕微鏡 超微量分析方法とその装置を提供することを課題として いる。

[0006]

【課題を解決するための手段】この出願の発明は、上記 【発明の属する技術分野】この出願の発明は、熱レンズ 40 の課題を解決するものとして、第1には、光学顕微鏡に おいて、励起光を入射し、励起光が試料中に照射される ことにより形成される熱レンズに検出光を入射し、熱レ ンズによる検出光の拡散を測定することにより試料中の 物質を検出を行う熱レンズ顕微鏡を用いた超微量分析方 法であって、光学的調整により、試料中における励起光 および検出光の焦点位置が一致しないようにすることを 特徴とする熱レンズ顕微鏡超微量分析方法を提供する。 【0007】また、この出願の発明は、第2には、励起

光と検出光の周波数を異なるものとし、色収差のあるレ ンズを対物レンズとして用いることにより、試料中にお

20

示した構成概略図である。この例において、励起光

ける励起光および検出光の焦点位置が一致しないように する熱レンズ顕微鏡超微量分析方法を、第3には、励起 光または検出光のいずれかを角度を持たせて光学顕微鏡 へ入射することにより、試料中における励起光および検 出光の焦点位置が一致しないようにする熱レンズ顕微鏡 超微量分析方法も提供する。

【0008】そして、この出願の発明は、第4には、光 学顕微鏡としての接眼レンズと対物レンズ並びに試料ス テージを備えた請求項1の方法のための装置であって、 励起光と検出光の光源と、試料中での励起光と検出光の 10 焦点位置を一致させない光学調整装置と、試料透過光の 集光装置とを有し、励起光と検出光とは接眼レンズに入 射されて対物レンズより試料ステージ上の試料に放射さ れ、光学調整装置によって励起光と検出光の試料中の焦 点位置は一致しないようにされ、試料透過光は集光装置 により集光されて透過光のうちの検出光のみから分析が 行われることを特徴とする熱レンズ顕微鏡超微量分析装 置を提供する。さらにまた、この出願の発明は、第5に は、励起光と検出光の周波数を異なるものとした請求項 4の装置であって、色収差のあるレンズを対物レンズと して光学調整装置を構成している熱レンズ顕微鏡超微量 分析装置を、第6には、第4の発明の装置であって、ビ ームエキスパンダーにより、励起光または検出光のいず れかを角度を持たせて光学顕微鏡に入射するようにして 光学調整装置を構成している熱レンズ顕微鏡超微量分析 装置を提供する。

[0009]

【発明の実施の形態】この出願の発明は、上記のとおり の特徴をもつものであるが、以下にその実施の形態につ いてさらに詳しく説明する。なによりもこの出願の発明 30 では、励起光と検出光の焦点位置を光学的調整によって 一致しないようにすることで、光学顕微鏡系であって、 しかも熱レンズ顕微鏡であることを特徴としている。

【0010】ここで、光学顕微鏡、あるいは光学顕微鏡 系との規定は、接眼レンズと対物レンズとのレンズ構成 を有しているもの、あるいは、さらにはこれに加えて、 対物レンズに対向する試料ステージを有しているものを 意味している。そして、この発明の装置は、前記のとお り、光学顕微鏡としての接眼レンズと対物レンズ並びに 試料ステージを備えた装置であって、励起光と検出光の 光源と、試料中での励起光と検出光の焦点位置を一致さ せない光学調整装置と、試料透過光の集光装置とを有 し、励起光と検出光とは接眼レンズに入射されて対物レ ンズより試料ステージ上の試料に放射され、光学調整装 置によって励起光と検出光の試料中の焦点位置は一致し ないようにされ、試料透過光は集光装置により集光され て透過光のうちの検出光のみから分析が行われることを 特徴としている。

【0011】図1は、この出願の発明に係る熱レンズ顕 微鏡超微量分析方法とその装置の一つの実施の形態を例 50

(A) は励起光源(1) から出力される。励起光源 (1) から出力された励起光 (A) は、チョッパ (2) によって変調される。また、検出光源(3)から出力さ れた検出光(B)は、ダイクロックミラー(4)によ り、変調後の励起光(A)と同軸にて合成される。励起 光(A)と検出光(B)からなる合成光(C)は、反射 ミラー(5)によって反射され、接眼レンズ(6)から 光学顕微鏡(7)内部へ入射される。励起光源(1)お よび検出光源(3)には、たとえば、アルゴンレーザー 光源やヘリウムネオンレーザー光源といった各種レーザ 一光源が適宜に用いられる。

【0012】光学顕微鏡(7)内部に入射された合成光 (C) は、対物レンズ(8) より出力され、ステージ

- (9) に設置された試料(10) に照射される。試料内 部においては、合成光(C)を構成する励起光(A)の 一部により光熱変換現象に基づき熱レンズが形成され、 熱レンズを通過した検出光(B)は拡散し、光熱変換に 関わらなかった励起光(A)とともに試料中を透過す る。原理的には励起光(A)も熱レンズの影響を受ける が、検出光(B)に比べてわずかである。ステージ
- (9) は水平方向、垂直方向に移動することが可能であ り、水平方向に移動することにより、2次元走査分析が 可能である。

【0013】試料(10)を透過した合成光(C)は、 ピンホール(11)を経て集光される。集光された合成 光(C) は反射ミラー(12)によってレンズ(13) に入力されさらに集光され、フィルタ(14)へ入力さ れる。フィルタ(14)により、合成光(C)を構成す る成分としての励起光 (A) の成分は遮断され、検出光 (B) の成分が、フォトダイオード(15) に入力さ れ、電気信号に変換される。電気信号は、プリアンプ (16) によって増幅されロックインアンプ(17) に 入力され、チョッパ(2)を制御するチョッパ制御装置 (18) からのリファレンス信号と併せて計測される。 ロックインアンプ(17)から出力される計測結果を示 す信号は、コンピュータ(19)に入力され、試料(1 0) の分析がなされる。

【0014】そして、この発明では、熱レンズ顕微鏡超 微量分析を行うために、対物レンズ(8)より試料(1 0) 中へ入射される励起光 (A) と検出光 (B) の焦点 位置が一致しないようにする。そのための光学調整法と しては、たとえば励起光(A)と検出光(B)の周波数 を異なるものとし、色収差のあるレンズを対物レンズ (8) として用いる方法がある。また、ビームエキスパ ンダー(20)を用いて、励起光(A)または検出光 (B) のいずれに角度を持たせて光学顕微鏡 (7) の接 眼レンズ(6)へ入射する方法が挙げられる。後者の方 法については、原理的には励起光(A)と検出光(B) のどちらに対してもビームエキスパンダー(20)を用

6

いてもよいが、ビームエキスパンダー(20)を構成する光学素子による機械的な振動の発生とより精度の高い分析のためには検出光(B)は安定した状態であることが望ましいことを考慮すると、励起光(A)に対してビームエキスパンダー(20)を適用することが好ましい。

【0015】以上の特徴について、以下に実施例を示し、さらに具体的に説明する。

[0016]

【実施例】実施例1

この出願の発明に係る熱レンズ顕微鏡超微量分析の空間分解能を、図1の構成の装置において、銀薄膜を蒸着したガラス基板を用いた分析として評価した。励起光源として、アルゴンレーザー光源を用いた。また、検出光源として、ヘリウムネオンレーザー光源を用いた。励起光と検出光の焦点位置が一致しないように色収差のあるレンズを対物レンズ(8)として用いた。

【0017】銀薄膜が蒸着されたガラス基板を1方向へ走査し、透過光の強度を電圧として測定した結果を図2に示す。図2より明らかなように、銀薄膜端点が信号が立ち上がっている。これより、この装置の空間分解能が約 1.0μ mであることがわかる。このことから、空間分解能は、検出光のスポット径に等しく、この出願の発明に係る熱レンズ顕微鏡超微量分析は、微粒子の検出に優れた能力を持つことがわかる。

実施例2

熱レンズ信号が吸光度に比例することを利用して、この 出願の発明に係る熱レンズ顕微鏡超微量分析による濃度 分布の定量的な画像化を試みた。

【0018】具体例として、抗生物質トブラマイシンが 30 尿細管の組織内に取りこまれていく経時変化の画像化を行った。金コロイドで標識した抗体を用いてトブラマイシンを免疫染色した。励起光源として、アルゴンレーザー光源を用いた。また、検出光源として、ヘリウムネオンレーザー光源を用いた。励起光と検出光の焦点位置が一致しないように色収差のあるレンズを対物レンズとして用いた。

【0019】図3に、定量測定した結果を示した。比較例として、図4に、同じ測定対象に対する反射型共焦点レーザー顕微鏡による定量測定結果を示した。図3および図4において、a)からd)は、それぞれトブラマイシンを摂取してから、0時間後、1時間後、4時間後、8時間後の画像である。トブラマイシンに対する良好な検量線も得られており、検量線との対比からb)、

c)、d)の画像でそれぞれ、組織内に10fmol、5fmol、1fmolのトブラマイシンが存在していると推定される。また、時間が経つにつれて、トブラマイシンが尿細管組織から排出されていく様子も知ることができる。

【0020】図3と図4の比較により、共焦点レーザー 50

顕微鏡による画像(図4)では、標識金コロイドに対応すると考えられる輝点が離散的に見えるのに対して、この発明の熱レンズ顕微鏡超微量分析による画像(図3)では、滑らかな連続的な分布が得られている。代謝過程や組織構造から考えて、トブラマイシンが離散的に分布することは考えにくく、この発明の熱レンズ顕微鏡超微量分析による画像の方が正確かつ定量的に分布像を示していると考えられる。

実施例3

0 さらに、この出願の発明に係る熱レンズ顕微鏡超微量分析を、小型ゲルを用いた短距離電気泳動によるDNAの高空間分解検出に適用した。

【0021】図5はその状態の概要を示したものである。この図5においては、励起光(51)と検出光(52)がゲル(53)中の試料バンド(54)に対物レンズ(60)を介して照射される。熱レンズ(55)が利用されている。透光した光はピンホール(56)、フィルター(57)、集光レンズ(58)を介して集光され、透過した検出光のみがフォトダイオード(59)において検知されることになる。この検知により分析が可能とされる。

【0022】ガラスプレートを用いて、縦25mm、横 28mm、厚さ80μmである小型の不連続ポリアクリ ルアミドゲル (濃縮ゲル:長さ5mm、3%T、3% C、緩衝液pH6.8Tris/HCl、分離ゲル:長 さ70mm、7.5%T、3%C、緩衝液pH8.8T ris/HCl) を作成した。試料として、10bas e pair ladder(bpl) DNA試料を用 いた。電極緩衝液には、pH8.3Tris/Glyc ine溶液を用い、30~120V/cmの電場で、3 ~5分間電気泳動分離を行った。DNA分離パターンを 銀染色した後、図1に例示した構成の装置を用いて検出 を行った。励起光源として、アルゴンレーザー光源を用 いた。また、検出光源として、ヘリウムネオンレーザー 光源を用いた。励起光と検出光の焦点位置が一致しない ように色収差のあるレンズを対物レンズとして用いた。 【0023】図6に示すように、実際に得られたDNA

試料のバンド幅は 100μ mであり、これは従来の大きさのゲルを用いた場合の約1/10の幅である。分離に要した泳動距離は16mm、時間は15分であり、これは従来の大きさのゲルを用いた場合の10倍以上速い。分離された各試料バンドは、肉眼では約1500bpまでしか検出できないが、この出願の発明に係る熱レンズ顕微鏡超微量分析により2400bpまでの検出が可能であった。

【0024】以上より、この出願の発明に係る熱レンズ 顕微鏡超微量分析は、優れた空間分解能を有しており、 また、この空間分解能を利用した小型試料の測定も可能 となり、測定時間の短縮に貢献することがわかった。

[0025]

【発明の効果】この出願の発明により、空間分解能や定量分析能力に優れ、かつ、生体細胞や組織などのin-vitro、in-vivo測定が可能である光学顕微鏡の構成として、超微量分析顕微鏡が実現する。さらに、高い空間分解能や定量分析能力を応用することにより、試料を小型化し、分析時間を大幅に短縮することや試料量を低減することも可能となる。

【0026】また、光熱変換分工法の利点や特徴を有することから、熱拡散率や比熱などの熱物性物理量の分布測定や超光速時間分解測定などにも応用可能であると考 10 えられる。以上より、この出願の発明に係る熱レンズ顕微鏡超微量分析装置が、今後の材料開発や物理化学研究、生体工学研究などに対して極めて有効な手段となることが期待される。

【図面の簡単な説明】

【図1】この出願の発明に係る熱レンズ顕微鏡超微量分析装置の実施形態を例示した構成概略図である。

【図2】この出願の発明の実施例1におけるガラス基板 上銀蒸着膜の1次元走査測定結果を示した図である。

【図3】この出願の発明の実施例2において、この出願20の発明に係る熱レンズ顕微鏡超微量分析装置により画像化された、金コロイド免疫染色した尿細管組織中のトブラマイシン分布像を示した図である。

【図4】反射型共焦点レーザー顕微鏡により画像化された、金コロイド免疫染色した尿細管組織中のトブラマイシン分布像を示した図である。

【図5】この出願の発明の実施例3における小型ゲルを 用いた短距離電気泳動によるDNAの高空間分解検出を 示す概略図である。

【図6】この出願の発明の実施例3における測定結果を 30 示した図である。

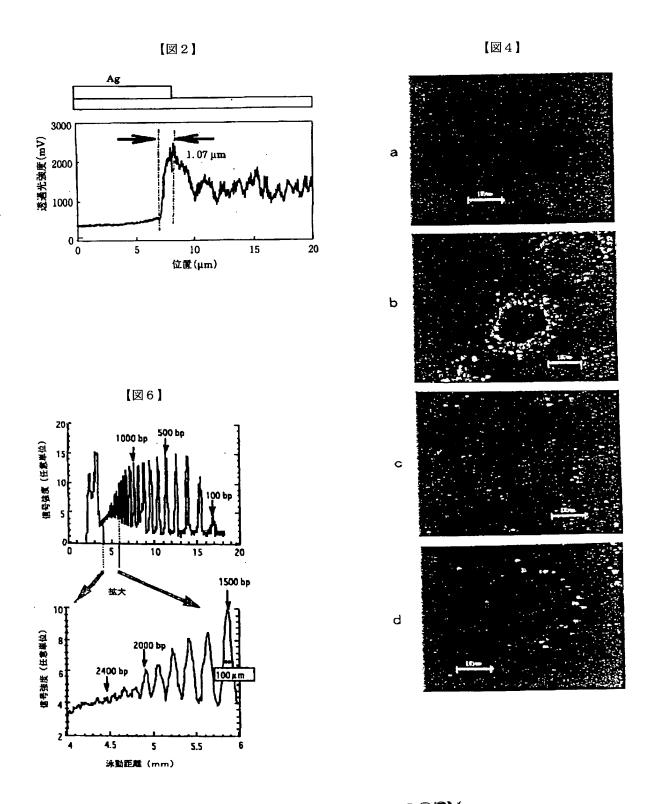
【符号の説明】

A 励起光

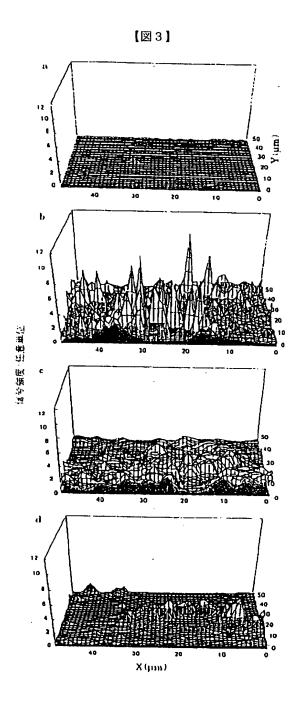
* B 検出光

- C 合成光
- 1 励起光源
- 2 チョッパ
- 3 検出光源
- 4 ダイクロックミラー
- 5 反射ミラー
- 6 接眼レンズ
- 7 光学顕微鏡
- 0 8 対物レンズ
 - 9 ステージ
 - 10 試料
 - 11 ピンホール
 - 12 反射ミラー
 - 13 レンズ
 - 14 フィルタ
 - 15 フォトダイオード
 - 16 プリアンプ
 - 17 ロックインアンプ
 - 18 チョッパ制御装置
 - 19 コンピュータ
 - 20 ビームエキスパンダー
 - 5 1 励起光
 - 5 2 検出光
 - 53 ゲル
 - 5 4 試料バンド
 - 55 熱レンズ
 - 56 ピンホール
 - 57 フィルター
-) 58 集光レンズ
 - 59 フォトダイオード
 - 60 対物レンズ

*



___ AVAILABLE COPY



BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)